



測試報告

號碼：CE/2007/13058A

日期：2007/06/13

頁數：1 of 3

合品科技股份有限公司
桃園縣楊梅鎮梅獅路二段445巷1號



以下測試樣品係由客戶送樣，且由客戶聲稱並經客戶確認如下：

樣品名稱	:	Si WAFER
樣品型號	:	合品科技股份有限公司
收件日期	:	2007/01/12
測試期間	:	2007/01/12 TO 2007/01/19

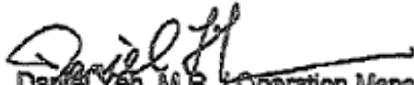
測試需求 : 參照 RoHS 2002/95/EC 及其修定指令要求。

測試方法 : 參考 IEC 62321, Ed. 1 111/54/CDV 方法檢測。

- (1) 用感應耦合電漿原子發射光譜儀 (ICP-AES) 檢測錳含量。
- (2) 用感應耦合電漿原子發射光譜儀 (ICP-AES) 檢測鉛含量。
- (3) 用感應耦合電漿原子發射光譜儀 (ICP-AES) 檢測汞含量。
- (4) 針對非金屬材質之樣品，用 UV-VIS 檢測六價鉻含量。
- (5) 以氣相層析儀/質譜儀 (GC/MS) 檢測多溴聯苯和多溴聯苯醚含量。

測試結果 : 請見下一頁。

結論 : 根據客戶所提供樣品的測試結果，符合 RoHS (2002/95/EC) 及其修定指令之要求。


 Daniel Yen, M.R., Operation Manager
 Signed for and on behalf of
 SGS TAIWAN LTD.
 Chemical Laboratory - Taipei

This Test Report is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf or available on request and accessible at www.sgs.com. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues defined therein. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. 此報告係根據本公司訂定之標準與方法所製成，若未經本公司許可，不得影印、複製、轉載或將內容或外觀之任何未經授權之變更、偽造、篡改等情事，違犯者將會被依法追訴。

TW 5031782